

非接触三次元測定装置によるウェハ反り評価

非接触三次元測定装置

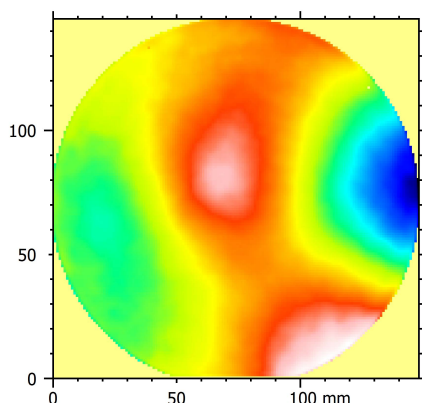
スペック

- 測定原理 : ポイントオートフォーカスプローブ
[特徴]試料表面の色や反射率の影響を受けることなく広範囲の高精度測定が可能
- 可動範囲 : X軸 250mm, Y軸 200mm, Z軸 100mm
- 高さ測定(Z) : 測定精度 $(0.3 + 0.5 L / 10) \mu m$ ※L : 測定視野領域幅(mm)
- 幅測定(X,Y) : 測定精度 $(2 + 4 L / 1000) \mu m$ ※L : 測定視野領域幅(mm)
- 測定再現性 : $\sigma = 0.03 \mu m$
- 評価物条件 : 最大高さ 105mm, 最大重量12kg

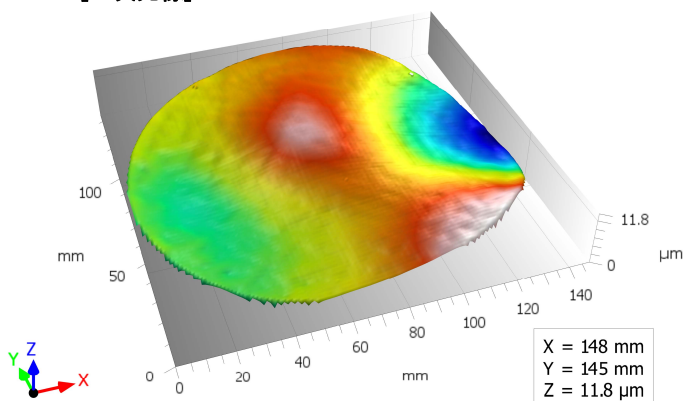
分析事例:6インチSi ウェハの反り評価

■観察データ

[二次元像]

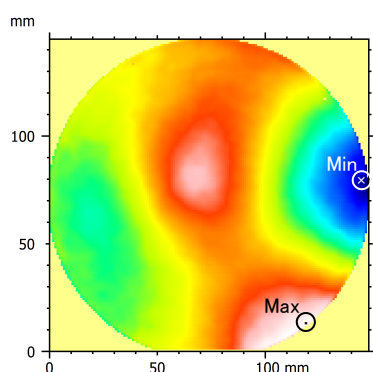


[三次元像]

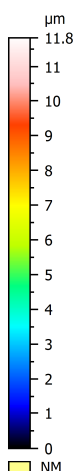


■解析データ

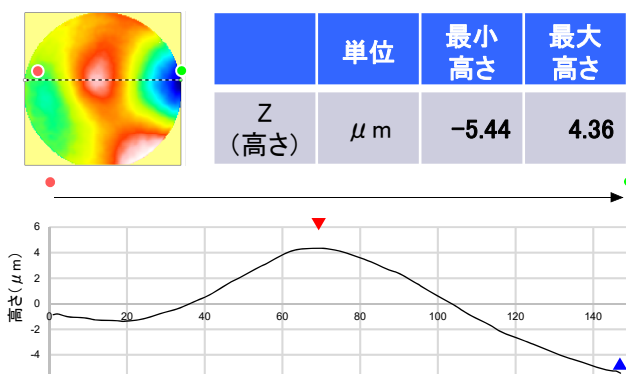
[最大高低差]



最大高低差: 11.8 μm



[断面解析]



✓ 指定した任意の断面で解析可能

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <https://www.mst.or.jp/>